SACLA における RF 異常波形データの捕捉 CAPTURE OF ABNORMAL RF WAVEFORM AT SACLA

大島隆^{#, A)},前坂比呂和^{A)},稲垣隆宏^{A)},原徹^{A)},長谷川太一^{B)},吉岡 正倫^{B)},丸山俊之^{C)},大竹雄次^{A)}

Takashi Ohshima ^{#, A)}, Hirokazu Maesaka^{A)}, Takahiro Inagaki^{A)}, Toru Hara^{A)}, Taichi Hasegawa^{B)}, Masamichi

Yoshioka^{B)}, Toshiyuki Maruyama^{C)} and Yuji Otake^{A)}

^{A)} RIKEN SPring-8 Center, XFEL Division

^{B)} SPring-8 Service Co. Ltd.

^{C)} Nippon Gijutsu Center Co.,Ltd.

Abstract

To maintain high availability as a user machine, such as the XFEL facility SACLA, quick recovery from troubles is important. To diagnose the source of the trouble we should collect information related to it as much as possible. For example, when we find an intensity fluctuation of XFEL, we search data which correlate with the intensity fluctuation. The point data of pulsed signals, such as a beam position, a beam current, an rf phase and amplitude detected with a cavity pickup, are saved for every shot. But a time interval to save the waveforms of the cavity phase and amplitude is 10 minutes, because of the limited data transfer speed of the VME bus, and we may lose the waveforms at the abnormal event. So we made a system to capture the abnormal waveforms to diagnose the trouble source. The system utilizes a function of an ADC, for which makes an interrupt signal when the acquired waveform has deviation from the reference waveform. The system was operated and successfully caught the abnormal rf phase waveform of the C-band correction cavity. At that time the waveform deviation was not observed in a klystron cathode voltage waveform, nor the klystron drive rf waveform but in a klystron output rf phase. So we could deduce that the trouble was in the klystron itself and after the replacement of the klystron, the X-ray intensity was stabilized. This example demonstrates that this system is helpful for a machine troubleshooting. This surveillance system will be applied to other units to catch unusual operation status.

1. はじめに

Spring-8 Angstrom Compact LAser (SACLA)はX線 領域での SASE 発振を実現し、高輝度短パルス X 線 を用いて原子の2光子吸収など非線形過程の観測、 非結晶タンパク質の構造解析など様々な実験を行う ための施設である[1]。長期にわたって安定にレー ザーを供給するためには、さまざまな構成要素の安 定度を高く保つ必要がある。特に高周波加速空洞の 位相、振幅は電子ビームのバンチ圧縮やビームエネ ルギーに強く影響するため、監視を怠ることはでき ない。環境温度や湿度、受電電圧などゆっくりした 変動が予想されるデータについては 2 秒間隔などソ フトウエアで決めた一定の周期でデータベースに保 存される[2]。しかし、電子ビームの電荷量やビーム 位置、加速空洞の位相、振幅などショットごとに変 化する可能性を持つデータについては、全ショット を記録することが望ましい。そのため、ビーム ショットごとにタグ番号(trigger count)を割り当てて 保存している。この時に保存されるデータは、マス ターとなるトリガ信号 (master trigger) を規定時間 だけ遅延させた信号で ADC をトリガし、得られた ADC の波形データのうち、あらかじめ指定したタイ ミングでのサンプル値または波形内のピーク値(ポイ ントデータ)である。このデータを収集するためのプ ロセス (SYNC DAQ-EMA) はコミッショニング時 から動作している[3]。

ポイントデータに何らかの変動がみられた場合に、 波形全体がシフトしているのか、それとも波形の一 部だけが変動しているのかによって、変動の要因が 異なる場合がある。そのため、異常が発生した際の 波形データを確認できるようにしておくことは重要 である。しかし、既存のデータ収集システムでは、 保存するデータ容量の問題や VME バスの通信速度 による制限などから、波形データの保存は 10 分毎 に設定されており、異常発生時の波形が保存できて いない場合が多い。そこで、我々は、ADC ボード内 に基準とする波形を設定し、その波形からのずれが 許容値を超えた場合に、その異常波形およびその前 後のショットの波形データを保存する機能を持つ ADC を開発した^[4,5]。この機能を用いて異常が発生 した際に、関連する信号の波形も含めて異常波形を 保存するシステムを構築した。本論文では、異常波 形捕捉のためのシステムの概要を説明し、異常波形 捕捉の実施例について紹介する。

2. 異常波形収集システムの概要

RF 機器を制御する VME の CPU 上では、ショッ ト毎のポイントデータを収集するためのプロセス (SYNC DAQ-EMA)、加速空洞の位相および振幅 を安定化させるプロセス(PID-EMA)が動作している (Figure 1 参照)。これに加えて、異常波形収集の プロセスを新たに制作した。

[#] ohshima@spring8.or.jp



Figure 1: Configuration of LLRF and data acquisition system for each RF unit.

異常波形収集は次の手順で行われる。加速空洞の ピックアップ信号、クライストロンの出力信号、ク ライストロン modulator 電圧信号などの計測には 238MHz のクロックで動作する VME 規格の ADC を 用いている。ADC で保存されるデータは1波形あた り 2048 ポイントで約 8µs の時間に対応する値を記 録できる。ADC ボード内には 512 個の波形を記録で きるメモリバンクが 4 つある。あらかじめ空洞ピッ クアップ信号に対応する ADC ボードに正常動作時 の波形を基準波形として設定する。ADC ボードは ビームショット毎に取得した波形データと基準波形 データを比較し、閾値から外れた場合にインタラプ ト信号を発生すると同時に、データ更新による異常 波形データの消失を防ぐために波形データを保存す るバンクを切り替える(Figure 2 参照)。VME の CPU 上で動作する異常波形データ収集プロセス (ALM-EMA) は、ADC ボードからのインタラプト 信号を監視するスレッドとデータを収集するスレッ ドで構成されている[6]。インタラプト監視スレッド では、インタラプト信号を受け取るとビームショッ ト毎に割り振られているタグ番号を取得し、また、 同時に関連する信号波形を収集している他の ADC ボードに対してもバンク切り替えを行う。データ収 集スレッドでは、該当する異常波形データとその前 後の波形データを収集し、タグ番号と波形データを データベースに保存する^[7]。RF 機器の起動直後や停 止時に波形が異常と判定されることを防ぐために、 異常波形監視プロセスに対する正常波形の設定およ び監視の開始コマンドの発行は、RF 機器が定常の 運転状態であることを確認したうえで行う。

各 RF ユニットでは、加速器の調整で加速空洞の 目標位相の変更を行う際には、位相振幅安定化プロ セス PID-EMA に対して位相の目標値を設定する。 異常波形監視において、オペレータの意図した位相 変更による波形の変化は異常波形ではないため、 PID-EMA に対して設定値の変更を与える場合には、 まず ALM-EMA に対して異常波形監視の停止を行い、 PID-EMA に設定値を送る。PID-EMA によって空洞 位相が目標値に対して許容誤差内に収まったことを 確認した後に ALM-EMA の異常波形監視を再開する。 クライストロン電源のフォールトなどでユニットの 運転が停止した際には、ALM-EMA は異常波形を記 録する。異常波形監視の再開は先ほどと同じように、 PID-EMA によって制御値が目標値に対して許容誤 差内に収まったことを確認した後に ALM-EMA の異 常波形監視を再開する。



Figure 2: Error detection at the ADC board.

現時点では、加速器の運転に大きな影響を与える ユニットや注意を要するユニットに対して個別に監 視プロセス ALM-EMA の立ち上げを行っているが、 2014 年秋の運転からは監視対象に含めるユニットの 数を増やす予定である。これらのユニットで動作す る ALM-EMA を制御する Graphical User Interface (GUI)については現在準備を進めている。Figure 3 に は試作した GUI の画面を示す。パネルには PID-EMA の起動、目標値の設定、ALM-EMA の起動、 許容値の設定を行うボタンや入力窓が用意されてい る。SACLA では 74 の加速ユニットがあり、個別に 窓を設けることは煩雑で見通しが悪い。そこで、加 速空洞の位相設定など PID-EMA の制御を行ってい る GUI に修正を行い、ユニットごとの異常波形の発 生頻度の監視、表示を行い、頻度が高いユニットに ついては詳細な調査を行うために運転員に警告を発 する機能を持たせることを検討している。



Figure 3: Sample of Graphical User Interface for abnormal waveform surveillance.

3. 異常波形捕捉の実施例

異常波形捕捉の実施例として、2013年10月2日 に C 補正空洞において見られた位相変動の様子を示 す。ポイントデータでは位相変動が捉えられている が、その発生頻度は Figure 4 に示すように 20 分間に 5回程度であり、その異常を捉えるには発生頻度が 低かった。この例のうち 13:00 頃に発生した異常波 形の例を Figure 5 に示す。異常波形を検知した際に は、a)空洞位相・振幅波形だけでなく、b)クライス トロン出力高周波の位相・振幅波形、c)クライスト ロン modulator 出力電圧波形も同時に取得した。空 洞波形、およびクライストロンの出力波形には 0.6us のタイミングで通常では見られない 25 度近い 位相の変化が見られた。このタイミングに対応する クライストロンのカソード電圧は、異常・正常時と もに変化が見られなかった。また、RF の振幅につ いては、放電時のような大きな変化は見られなかっ た。このことから、この空洞位相変動の要因として はクライストロン modulator での異常や加速空洞内 での放電ではなく、クライストロン自身の出力異常 と同定された。原因としては、クライストロン内の 空洞でのマルチパクタや、寄生発振の寄与などが考 えられた。C 補正空洞では定格 50MW のクライスト ロンを半分以下の出力で運転していることから、ク ライストロンのロットによる特性の違いの影響を受 けやすいことが考えられた。対策として、クライス トロン励振 RF 電力の調整などを試みたが改善が見 られなかったため、クライストロンの交換作業を加 速器調整期間に実施した。その結果、Figure 4 のよ うな異常波形が見られなくなり、クライストロン本 体に異常があったことが確かめられた。このように、 異常波形データの収集システムは、加速器の運転上 での異常状態の原因の調査に役立つことがわかった。



Figure 4: Trend of point data of the C-band correction cavity phase.

4. まとめ

XFEL を安定に運転するためには異常発生時に故 障診断のための情報を得ることが重要である。パル ス運転を行っている加速器では、ショットごとに状 況が変化する可能性があり、異常時の波形を保存す ることは故障原因診断の有力な道具となりうる。わ れわれは、異常波形検出機能を持つ ADC を開発し、 加速空洞ピックアップ信号などの波形異常を検出し た際に、異常波形およびその前後の波形を記録する システムを構築した。C 補正空洞の位相に変動が見 られた時、このシステムで得た結果から、位相変動 の原因はクライストロン用 modulator ではなくクラ イストロン本体にあることを突き止めることができ た。今後はこの異常監視システムをほかの号機の監 視にも広め、加速器の安定運転への助けとする予定 である。



Figure 5: Normal and abnormal waveforms of a) the cavity pickup RF signal, b) the waveforms of the klystron output RF signal and c) the klystron cathode voltage.

謝辞

異常波形監視プログラムの構築には制御グループの 福井達氏、石井美保氏、籠正裕氏、山鹿光裕氏、細 田直康氏ほか多数の方々にご協力いただいた。運転 上の動作確認においては田中信一郎氏をはじめとす る運転員の方々や基盤光源チームの方々にご協力い ただいた。これらの方々に感謝の意を表する。

参考文献

- [1] H. Tanaka, "The SPing-8 Angstrom Compact Free Electron Laser (SACLA)", Proc. of IPAC2012, pp.2106-2110
- [2] R. Tanaka et al, "Inauguration of the XFEL Facility, SACLA, in Spring-8", Proc. of ICALEPCS2011, pp.585-588
- [3] M. Yamaga, et. al., "Event-Synchronized Data-Acquisition System for SPring-8 XFEL", Proc. of ICALEPCS2009, pp.69-71
 [4] Y. Otake, et al, "SCSS RF Control toward 5712 MHz Phase
- [4] Y. Otake, et al, "SCSS RF Control toward 5712 MHz Phase Accuracy of One Degree", Proc. of APAC2007, pp.634-636
 [5] T. Fukui, et al, "A Development of High-Speed A/D and
- [5] T. Fukui, et al, "A Development of High-Speed A/D and D/A VME Boards for a Low Level RF System of SCSS", Proc. of ICALEPCS2005, pO2.050-4
- [6] M. Yoshioka, et. al., "SACLA の RF 異常波形データ収集 フレームワーク", 第 11 回加速器学会年会 2014
 [7] Maruyama, et. al., "分散データベースのための Web サー
- [7] Maruyama, et. al., "分散データベースのための Web サー ビスフレームワークの開発",第 11 回加速器学会年会 2014